

光ナノ計測実践セミナーⅡ



産業技術総合研究所ナノプロセッシング施設(NPF)は、「光ナノ計測実践セミナーⅡ」を、2017年5月30日(火)産業技術総合研究所ナノプロセッシング施設にて開催いたします。超解像観察技術、共焦点技術、走査プローブ技術等を用いたナノスケールの計測・評価について講演していただく予定です。オーサーズ・インタビューの時間を設けましたので、講師の方々に個別に質問をすることが可能です。また、実習コースでは、NPFのレーザー顕微鏡や、走査プローブ顕微鏡(SPM)を用いた観察技術について、基本的なスキルを身につけていただけるコースとなっています。奮ってのご参加をお待ちしています。

尚、実習コースに関しましては、講演会に参加されていることが条件となります。

【講演】

【日時】2017年5月30日(火)12:55-17:20

【場所】産業技術総合研究所つくば中央2-12棟第6会議室

http://www.aist.go.jp/aist_j/guidemap/tsukuba/center/tsukuba_map_c.html

【参加費】無料

【定員】90名(先着順、参加登録をお願いします)

【セミナー案内/申し込み】

<https://ssl.open-innovation.jp/npf/training/h29-1/index.html>

【講演プログラム】

- 12:55-13:00 「はじめに」 産総研 共用施設ステーション 多田哲也
- 13:00-13:50 「超解像光学顕微鏡をもちいた生物試料の数十nm精度での観察技術」
産総研 バイオメディカル研究部門 加藤 薫
- 13:50-14:20 「バイオイメージングにおける超解像顕微鏡の原理と応用」
(株)ニコン 今井 健太
- 14:20-14:40 「ナノプロセッシング施設に於けるレーザー顕微鏡と走査プローブ顕微鏡」
産総研 ナノプロセッシング施設 山崎将嗣
- 14:40-15:00 休憩(オーサーズインタビュー)
- 15:00-15:30 「レーザー顕微鏡及びAFMを用いた表面性状評価」
オリンパス(株) 牛丸 元春
- 15:30-16:00 「白色コンフォーカル顕微鏡を用いたナノ計測」
レーザーテック(株) 小堀 亮
- 16:00-16:30 「空間分可能10nmを可能にするAFM-IR赤外分光分析スペクトロスコピーの現状」
(株)日本サーマルコンサルティング 浦山憲雄
- 16:30-17:00 「周波数変調AFMによる潤滑界面の顕微測定」
(株)島津製作所 粉川 良平
- 17:00-17:20 オーサーズインタビュー

【実習コース】

レーザー顕微鏡コース

日時:2017年5月31日(水)

定員:5名

短波長レーザー顕微鏡(OLS4100)を用いて、3次元測定、液浸観察を含め、レーザー顕微鏡のスキルを学んで頂きます。

走査プローブ顕微鏡コース

日時:2017年6月1日(木)

定員:4名

走査プローブ顕微鏡(SPM-9700)を用いて、SPM観察技術の基礎を学んで頂きます。

主催:

産業技術総合研究所 ナノプロセッシング施設(NPF)

共催

ナノエレクトロニクス計測分析技術 研究会(TSC)

電子メール tia-npf-school1@aist.go.jp

